
**Surface chemical analysis —
Secondary ion mass spectrometry
— Correction method for saturated
intensity in single ion counting
dynamic secondary ion mass
spectrometry**

*Analyse chimique des surfaces — Spectrométrie de masse des ions
secondaires — Méthode de correction de l'intensité de saturation en
SIMS dynamique à comptage d'ions individuel*



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn